



Laboratoire de
Technologie
Avancée

TOF-SIMS : une révolution dans l'analyse chimique des surfaces

Le Laboratoire de Technologie Avancée (LTA) veut élargir son champ d'analyse chimique des surfaces grâce à l'acquisition de nouveaux équipements dont pourront bénéficier les entreprises et les chercheurs : **un système TOF-SIMS et un XPS.**

La récente percée technologique dans le système TOF-SIMS permet une détection chimique ultime, avec une résolution spatiale d'une centaine de nanomètres sur tout type d'échantillon. Complétée par le XPS, elle devient un véritable atout pour la recherche et le développement de la région.



Le LTA vous invite à découvrir cette avancée technologique
mardi 20 juin 2017 à 14h
Grand auditoire de l'école de physique
24, quai Ernest-Ansermet – Genève

Programme

- 14h00 Accueil
- 14h10 Présentation du projet
Professeur Christoph Renner - LTA - UNIGE
- 14h15 Introduction aux nano-sims
Dr Gregory L. Fisher - Physical Electronics, USA (conférence en anglais)
- 15h00 Questions
- 15h30 Verrée et discussions

Inscription nécessaire avant le 15 juin 2017 : www.lta-geneve.ch/tof-sims